

AL DOTAR DE TECNOLOGÍA AVANZADA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS, LA BUAP FORTALECE LA INVESTIGACIÓN



Rector Alfonso Esparza entrega al ICUAP espectrómetro de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva

BUAP. 11 de julio de 2016.- Para fortalecer la investigación y dotar de tecnología avanzada a la institución, el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, puso en marcha el espectrómetro de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva, en el Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, del Instituto de Ciencias (ICUAP), el cuarto de su tipo en una institución pública y el más actualizado y de mayor rango para la detección de elementos químicos en el país.

Con la entrega de este dispositivo, cuyas características propiciarán las colaboraciones científicas con otros centros de investigación, además de la vinculación con los sectores productivos, Esparza Ortiz ratificó su compromiso de apoyar la investigación, pues es el principal recurso para generar desarrollo sostenible y crecimiento en un país.

“Siempre hemos estado muy interesados en apoyar la investigación, en tener a nuestro alcance lo último en tecnología y en tratar de que nuestra Institución sea líder en todos estos ámbitos. Además, a través de estos esfuerzos conjuntos, se demuestra una vez más el trabajo en equipo y, por ende, la generación de sinergias”, sostuvo.

Estamos convencidos, agregó, de que cuando se suma el conocimiento a cualquier actividad, se obtiene un beneficio que aporta mejores oportunidades de progreso.

Jesús Francisco López Olguín, director del ICUAP, señaló que el espectrómetro de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva beneficiará el trabajo de 26 investigadores de tiempo completo y cuatro técnicos del Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, quienes están organizados en tres cuerpos académicos y conforman la planta docente de una maestría y doctorado adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Javier Martínez Juárez, integrante del Cuerpo Académico de Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos, explicó que este equipo adquirido permitirá muestrear en forma versátil, rápida y sin destruir la muestra los elementos químicos que la componen. Los resultados se presentan en tiempo real con límites de detección de hasta en 20 partes por millón en muestras líquidas y sólidas.

Este centro, dijo, además, dispone de un difractómetro de rayos X, un sistema para conocer la disposición atómica en los materiales sólidos y, con ayuda de las bases de datos, descubrir el tipo de moléculas que conforman el material. Además, hace un año se adquirió e instaló la base de datos PDF-4+, para facilitar la identificación de materiales.

De esta manera, se tiene un paquete completo para el análisis de muestras líquidas y sólidas, así como de combustibles y aceites. Mostrando con ello, la capacidad de ofrecer servicios de calidad internacional, puntualizó Martínez Juárez.

Comunicación Institucional /Boletines/Noticias Importantes/2016/Julio/

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/al_dotar_de_tecnologia_avanzada_a_las_unidades_aca